

表面分析



[表面分析_下载链接1](#)

著者:沃茨

出版者:华东理工大

出版时间:2008-1

装帧:

isbn:9787562822264

《表面分析(XPS和AES)引论》讲述了现代电子能谱中的单色化XPS、小面积。XPS (SAX

PS)、成像XPS、XPS深度剖析、场发射AES/SAM等功能的分析技术,以及在冶金、腐蚀、陶瓷、催化剂、微电子半导体材料、黏合剂、涂料聚合物材料等领域中的应用;介绍了现代电子能谱仪中的微聚焦单色器、场发射体、离子枪、电子枪、能量分析器/传输透镜、荷电补偿器、多通道探测器、平行成像系统、平行数据采集、数据处理系统等等。书中将XPS和AES技术与其他表面分析技术作了比较。书后附有参考文献、中英文电子能谱分析技术名词术语、网络资源等一些有用的信息。

作者介绍:

目录:

[表面分析_下载链接1](#)

标签

材料学

2008

评论

XPS元素及化学态,薄膜厚度,厚度是否均匀及化学成分,劈裂峰。3p_{1/2},3p_{3/2},3d_{3/2},3d_{5/2}

[表面分析_下载链接1](#)

书评

内容当然没的说 可是翻译水平真的还好
完全按英文的感觉翻译,有的地方感觉一句话都不通顺。例如在英文的一句话里只有因为,或只有所以。但一般中文一句话会说因为什么所以什么。所以当译者按英文翻译过来也只有因为或只有所以,而断句之类也完全按英文的直译过来的时候,有时...

[表面分析_下载链接1](#)